## 横切窄缝屏蔽双绞线的电磁泄漏

田 方<sup>①②</sup> 龚中麟<sup>①</sup> <sup>①</sup>(北京大学信息科学技术学院电子学系 北京 100871) <sup>②</sup>(中国人民公安大学理科基础部 北京 100038)

**摘 要:**本文对屏蔽层横切窄缝的屏蔽双绞线的电磁泄漏进行了定量研究。分析了切缝屏蔽双绞线的电磁泄漏机制, 并把其等效为级联网络。采用混合方法,即传输线链参方法、有限元方法和亚网格 FDTD 方法相结合,对切缝屏 蔽双绞线的电磁泄漏进行了模拟分析。结果表明,在 500MHz 以下的频率内,即使屏蔽层被切断,屏蔽双绞线泄 漏的能量最多不超过 1%。

关键词:电磁泄漏;屏蔽双绞线;亚网格 FDTD 方法;混合方法 中图分类号:TN811,TM154.1 **文献标识码:**A

文章编号: 1009-5896(2007)05-1243-04

## The Electromagnetic Leakage of Shielded-Twist-pair with a Transverse Slot

Tian  $\operatorname{Fang}^{\odot 2}$  Gong Zhong-lin<sup>①</sup>

<sup>(1)</sup>(School of Electronics Engineering & Computer Science, Peking University, Beijing 100871, China) <sup>(2)</sup>(Division of Mathematics and Physics, Chinese People's Public Security University, Beijing 100038, China)

Abstract: This paper propose a quantitative analysis on the electromagnetic leakage from a shielded-twist-pair with a transverse slot. The mechanism of electromagnetic leakage is analyzed, and then the slotted shielded-twist-pair is regarded as a cascaded network. By applying the hybrid-method, which is the combination of the chain-parameter-equation, the finite-element-method and the subcell-FDTD-method, the electromagnetic leakage from the transverse slot on the shield of the twist-pair are simulated. The results show that, below the frequency of 500MHz, the leaked energy from the slotted shielded-twist-pair is no more than 1% even if the shield layer is cut off.

Key words: Electromagnetic leakage; Shielded-twist-pair; Subcell-FDTD-method; Hybrid-method

#### 1 引言

计算机局域网络中,双绞线电缆是被广泛使用的一种传 输媒质,其双绞结构用来增加传输线的抗扰性以及阻止传输 信号的外泄。为了进一步提高双绞线电缆的性能,可在其外 部包上屏蔽层,这就成为屏蔽双绞线。双绞线的铝箔屏蔽层 对于较高频率的电磁场有较好的屏蔽作用,而双绞线的互绞 结构对低频电磁场的泄漏或干扰有较好的抑制作用,因此屏 蔽双绞线有很好的抗电磁泄漏或抗干扰特性。然而从理论上 分析,当屏蔽层断裂或破损后,电磁泄漏会有所增强,传输 线本身的抗扰性会降低,还可能引起传输信息的泄漏。虽然 有些学者曾指出屏蔽层断裂时,屏蔽双绞线会产生电磁泄 漏,但没有对这种电磁泄漏形式进行定量的研究。本文假设 在屏蔽双绞线的屏蔽层上横向切一窄缝并把屏蔽层切断,来 代表屏蔽层发生断裂的一种简单情况,通过传输线链参方 法<sup>[1]</sup>、有限元方法和亚网格FDTD方法<sup>[2]</sup>相结合的混合方 法<sup>[3,4]</sup>,对横切窄缝屏蔽双绞线的电磁泄漏进行了定量的研 究。

#### 2 横切窄缝屏蔽双绞线电磁泄漏机制的分析

以目前通常使用的五类 4 对 24AWG100Ω 屏蔽电缆为 例,分析其电磁泄漏机制。为了便于分析,先对屏蔽双绞线 作简化处理,即去掉电缆中的3个线对,只保留其中的一个 线对,电缆的其它尺寸不变,如图1所示。图中 *d*为屏蔽层 内双绞线对称轴与屏蔽层中心轴的间距,称为偏心距离。偏 心距离 *d* 和角度 θ 决定了在某一截面处双绞线与屏蔽层的 相对位置。

设屏蔽双绞线长为 L, 电压源 V<sub>g</sub> 为双绞线的输入电压, 双绞线的差模终端负载为 Z<sub>L</sub>,环绕屏蔽层把屏蔽层完全切 断,并假设屏蔽层为理想导体,如图 2 所示。



图 1 屏蔽双绞线的简化模型 图 2 屏蔽层横切窄缝的屏蔽双绞线

由于整个屏蔽双绞线被视为非均匀传输线, 而被分割成 的传输线单元被视为均匀传输线,因此相邻的两个传输线单 元具有不同的θ角,它们的传输线参数是不同的,这样可以 把双绞线看作许多段参数不同的传输线的链接。文献[5]指 出,当两段不同传输线搭接时,在搭接处将产生共模线激励 电压,从而产生差模线与共模线的耦合。这种耦合会导致屏 蔽层有电流存在,如果把屏蔽层破坏,将对屏蔽层电流产生 阻碍,这时将会有电磁场从屏蔽层的破损处向外泄漏。如果 屏蔽层的破损为图 2 所示的形式,屏蔽层外表面可以等效为 以切缝处为馈点的偶极天线, 偶极天线的输入阻抗以集总参 数负载的形式串联在屏蔽层上。根据以上电磁泄漏机制的分 析,屏蔽双绞线的电磁泄漏可以称为二次共模泄漏,第一次 泄漏是由双绞线的差模电路向以屏蔽层为参考导体的共模 (传输模)电路泄漏, 第二次泄漏是在屏蔽层切缝处从该共模 (传输模)电路向以大地(或更远的导体)为参考导体的共模 (辐射模)电路泄漏。两次泄漏中包含两种耦合机制,第一种 耦合机制是不同传输线相互搭接时的差模线与共模线的耦 合<sup>[5]</sup>,而第二种耦合机制是传输线链接集总参数负载时的差 模线与共模线的耦合<sup>[3]</sup>。

# 3 横切窄缝屏蔽双绞线的等效电路及其参数的计算

把图 2 所示的横切窄缝屏蔽双绞线等效为图 3(a)所示的 级联网络,并且把切缝的屏蔽层等效为图 3(b)所示的偶极天 线, Z<sub>in</sub> 为等效偶极天线的输入阻抗。



传输线单元的链参矩阵为 $[\boldsymbol{\Phi}(l_i)]$ ,其中 $l_i$ 为传输线单元的长度。 $[\boldsymbol{\Phi}(l_i)]$ 的具体表达式见文献[6],其数值由ANSYS有限元仿真软件获得。把等效偶极天线视为细导体,用亚网格FDTD方法<sup>[2]</sup>求出天线的输入阻抗 $Z_{in}$ ,最后获得图 3 所示切缝处的链参矩阵 $[\boldsymbol{\Phi}_i]$ 为

$$\left[\boldsymbol{\varPhi}_{s}\right] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & Z_{\mathrm{in}} & Z_{\mathrm{in}} \\ 0 & 1 & Z_{\mathrm{in}} & Z_{\mathrm{in}} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
(1)

而终端负载处的链参矩阵为

$$\left[\boldsymbol{\Phi}_{L}\right] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 1/Z_{L} & -1/Z_{L} & 1 & 0\\ -1/Z_{L} & 1/Z_{L} & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
(2)

#### 4 完好屏蔽层的内侧电流分布

沿双绞线纵向的位置与 $\theta$ 角之间是一一对应的,同时 $\theta$ 角 还是决定双绞线截面结构的因素之一,因此下面将分析完好 的屏蔽层内侧电流随 $\theta$ 角的变化规律。令图 3 中的等效偶极 天线的输入阻抗  $Z_{in} = 0$  (即屏蔽层未切缝),用求解链参方程 的方法得到屏蔽层内侧的电流分布及其相位特点。在计算过 程中,总假设双绞线输入端的 $\theta$ 角为零。在屏蔽双绞线的两 端,双绞线与屏蔽层是断路的,因此两端处的屏蔽层电流为 零。下面分别考察双绞线互绞周期数(沿线的纵向, $\theta$ 角变化 360°的次数)、终端负载和信号源频率对屏蔽层内侧电流的 影响。

#### 4.1 互绞周期数对屏蔽层电流分布的影响

设双绞线的信号源电压幅值为 $V_g = 1$ V,频率为 f = 10MHz,差模线终端连接匹配负载 $Z_L = 100\Omega$ ,双绞线 与屏蔽层的偏心距离取最大值为d = 1.515mm,双绞线的互 绞周期长度( $\theta$ 角改变 360°所对应的双绞线长度变化)为 p = 0.1m。取互绞周期数 N分别为4,4.5 时,得到屏蔽层 内侧电流及其相位随 $\theta$ 角的变化规律,如图4所示。

由图 4 可看出,虽然屏蔽层内侧电流分布是不均匀的, 且具有区域分布性,但是电流的变化有一定的规律性。如图 4(a)所示,当双绞线的互绞周期数为整数时,电流随θ角的 变化有严格的周期性,周期大小为 360°,与双绞线的互绞周 期相同,并且电流在每个周期的峰值是相等的。从相位的变 化规律看,当双绞线有完整的互绞周期个数时,屏蔽层上几 乎所有点的电流是同相位的,如图 4(b)所示。

如图 4 (c)所示,当双绞线的互绞周期数为半整数时,虽 然电流随θ角也有强弱的交替变化,但电流变化周期不一样。 另外从图 4(c)还可看出,每个区域的最大电流位置的间隔都 为180°。从其相位的变化规律看,相邻区域的电流相位相反, 如图 4 (d)所示。

应该指出,由于电压源的频率仅为10MHz,使得电缆传



输的 TEM 波的波长远大于传输线的总长度,因此屏蔽层内 侧的电流不是驻波电流,其分布规律与双绞线的互绞周期是 相关的。

#### 4.2 终端负载对屏蔽层电流的影响

当把终端负载短路 ( $Z_L = 0$ ), 互绞周期数 N 分别为 4.5、 5 时,其它参数与上面的相同,通过模拟得到双绞线屏蔽层 内侧的电流分布,如图5所示。



图 5 终端负载阻抗为零目互绞周期数不同时的屏蔽层电流分布

由图 5 可见,除了互绞周期对电流分布有影响外,终端 负载的大小也对电流有影响。图中显示了从信号源到负载, 屏蔽层电流是以波动形式减弱的。此时,互绞周期为整数与 半整数的电流分布规律相近。电流分布的波动特点仍然是互 绞周期引起的,而电流的减弱是由于当 $Z_{L}=0$ 时,差模电压 从信号源到负载的减弱引起的,这说明差模电压是屏蔽层电 流的源。

#### 4.3 信号源频率对屏蔽层电流的影响

当终端为匹配负载,信号源频率分别取 50MHz 和 100MHz,其它参数与上面相同时,通过模拟得到屏蔽层内 侧电流分布,如图6所示。



#### 图 6 不同频率时的屏蔽层电流分布

图 6(a)和图 6(b)的共同特点为,当频率升高时,电流峰 值会增大。图中频率为100MHz时的屏蔽层电流大约为 50MHz的两倍。图 6(a)和图 6(b)的不同点为,当互绞周期 数为半整数 (N = 4.5) 时,在屏蔽层内侧会出现较大的背景电 流,并且背景电流随着频率的升高而增大,而互绞周期为整 数(N = 5)时的背景电流几乎为零。

#### 横切窄缝屏蔽双绞线的电磁泄漏 5

设图 2 所示的屏蔽双绞线长L = 1m, 互绞周期 p =0.1m, 双绞线与屏蔽层的偏心距离取最大值为 d = 1.515mm, 缝隙的位置坐标分别为 z = 0.5m和 0.55m。通 过计算得到电磁辐射功率与信号源入射功率的比值,如图 7 所示。



## 位置改变时的电磁泄漏

距离改变时的电磁泄漏

当互绞周期为 0.1m 时, 1m 长的屏蔽双绞线有 10 个完 整互绞周期,当没有切缝存在时,z=0.55m的位置恰好是 电流最大处,而z = 0.5m处的电流非常微弱。特别指出, z = 0.5m 处电流不完全为零,随着频率的上升,背景电流也 越来越明显,如图 6(a)所示。从图 7 总体上看,屏蔽层在电 流较大的位置被截断时,电磁泄漏较大。另外还可看出,泄 漏的能量随频率的变化是剧烈的。一般的局域网络信号频谱 在100MHz以内,在这个频谱范围内,泄漏的能量在-120dB 以下,泄漏极其微弱。图中的曲线随频率波动没有一定规律, 这是由多个原因引起的,如切缝对传输线的影响、双绞线与 屏蔽层组成的共模电路的谐振以及等效偶极天线的谐振都 会引起曲线的波动。

下面保持切缝位置在屏蔽层的最大电流处, 来考察偏心 距离 d 对电磁泄漏的影响。如图 8 所示, 双绞线与屏蔽层的 偏心距离 d 取不同值时, 电磁泄漏的强弱有很大差别。总体 上看, 偏心距离为d = 1.515mm (最大值)时的泄漏比 d = 0.646mm 时的泄漏大 2 到 3 个数量级以上,这是因为双 绞线与屏蔽层的偏心距离越大,就越靠近屏蔽层,受屏蔽层 的影响越大,导致传输线的不均匀性越强,引起的共模线激 励电压越大。另外还可看出,在所观察的频率范围内,即使 偏心距离最大时的泄漏,其最高峰值(260MHz 附近)也只在 1%左右,绝大多数频率点对应的泄漏都在千分之一以下,可 见屏蔽双绞线的电磁泄漏是非常小的。

还需要说明,以上横切窄缝屏蔽双绞线的电磁泄漏结果 是在忽略切缝的缝隙电容的前提下得出的。如果考虑缝隙电 容的旁路作用, 电磁泄漏还要在一定程度下减少。

#### 6 结束语

本文分析了切缝屏蔽双绞线的电磁泄漏机制,把电磁泄 漏的原因归结为双绞线的互绞结构和偏心引起的传输线不 均匀性而导致的一次耦合,以及切缝导致的二次耦合。应用 混合方法模拟分析了屏蔽双绞线的屏蔽层完好时的屏蔽层 内侧电流分布规律以及屏蔽层横切窄缝时的电磁泄漏特点。 最后的结论是,即使屏蔽双绞线的屏蔽层被切断,电磁泄漏 仍然是很微弱的,在0到500MHz的频率范围内,其泄漏的 能量不超过 1%。本文中所采用的分析方法及分析结果对电 磁兼容领域和信息电磁泄漏领域都有比较重要的意义。

### 参考文献

- Hamada S, Kawashima T, and Ochura J. Influence of balance-unbalance conversion factor on radiated emission characteristics of balanced cables. IEEE International Symp. on Electromagnetic Compat., 2001: 31–36.
- [2] Taflove A, Umashankar K R, and Beker B, et al. Detailed FD-TD analysis of electromagnetic fields penetrating narrow slots and lapped joints in thick conducting screens. *IEEE Trans. on Antennas Propagat.*, 1988, 36(2): 247–257.
- [3] 田方, 龚中麟. 混合方法模拟差模传输线的共模电磁泄漏. 电 子与信息学报, 2005, 27(12): 2000-2004.

Tianfang and GongZhonglin. Simulating the Common Mode Electromagnetic Leakage of Differential Mode Cables by a Hybrid Method. Journal of Electronics & Information Technology, 2005, 27(12): 2000–2004.

- [4] 田方, 龚中麟. 基于混合方法模拟纵向长切缝同轴线的电磁泄漏. 高技术通讯(增刊), 2004: 204-208.
- [5] Watanabe T, Wada O, and Toyota Y. Estimation of common- mode EMI caused by a signal line in the vicinity of ground edge on a PCB. IEEE International Symp. on Electromagnetic Compat., Minneapolis, Minnesota, USA, 2002: 113–118.
- [6] Paul C R. Useful matrix chain parameter identities for the analysis of multiconductor transmission lines. *IEEE Trans.* on MTT., 1975, 23(9): 756–760.
- 田 方: 男,1969年生,博士生,研究方向为FDTD算法、天线以及计算机网络信息电磁泄漏.
- 龚中麟: 男,1940年生,教授,博士生导师,主要研究方向为电磁 场理论、天线与电波传播、微波电子学等.